高温下で CO2 トラッピング能を有するセラミック系 CO2 高選択透過膜の創製

広島大学大学院先進理工系科学研究科 化学工学プログラム 教授 金指 正言

1. 緒言

化石燃料の消費に伴う大気中への過剰な CO₂排出は,地球温暖化や気候変動などの環境 問題を引き起こす [1,2]。また,天然ガス中に CO₂が含まれると発熱量が低下し,パイプ ラインの腐食の原因になるため大きな課題になっている。これらの問題を解決する有効な 方法として,省エネプロセスでの CO₂の分離・回収が検討されている。CO₂の分離回収に は,CO₂/N₂,CO₂/CH₄,H₂/CO₂などがあり [3,4],膜を用いた分離技術は,省エネルギー, 連続運転が特徴であり,次世代の分離技術として注目されている [2]。

無機材料と有機材料を用いた CO₂分離膜の製膜法, 透過特性がこれまでに多数論文報告 されている [2,5-12]。例えば, "Interface-Decoration-Layer"を製膜コンセプトとして作製 された薄膜複合膜 (TFC) は, 2860 GPU という高い CO₂透過率と CO₂/N₂選択性 28 を 示した [13]。Wang らは poly(ethylene glycol)diamines をインターカレートした酸化グラ フェン膜が, 176 GPU の CO₂ 透過率と CO₂/CH₄ 選択性 70 を示すことを報告している [14]。促進輸送膜に関する研究報告では, Han らはナノチューブをハイブリッドすること で,構造安定性の向上に成功している [10]。しかし, プロセス強化の観点から, 現状の CO₂ 分離膜の課題は CO₂ 透過性の向上であり [13], できるだけ高い CO₂ 透過率と適度な CO₂/N₂選択性を有する CO₂分離膜の開発が期待されている。

オルガノシリカ膜は、高い水熱安定性と優れた分子ふるい特性から注目されており、 様々なガス分離への応用が期待されている [15-19]。Bis(triethoxysilyl)ethane (BTESE) を用いてゾル-ゲル法で製膜したオルガノシリカ膜は、CO₂/N₂選択性が 28、CO₂/CH₄選択 性が 90 と適度な CO₂選択性を示すが、CO₂透過率は 10⁻⁷ mol m⁻² s⁻¹ Pa⁻¹ (300 GPU)程度 で、高透過化が必要である [20]。オルガノシリカ膜のマイクロポーラス構造および分離特 性は、"スペーサー法"によって Si 間の橋架け基で制御することができる[18,21]。研究者 らは、炭素数の異なる橋架け基がオルガノシリカ膜の微細構造と透過特性に及ぼす影響を 検討し、気体透過モデルより算出した膜の細孔径は、橋架け基の炭素数が増加するにつれ て大きくなることを明らかにしている [22]。しかし、Si 間のカーボン数が 3 以上 (Si-C3-Si) になると、C3 基の折れ曲がりが生じ、細孔径、空隙構造を精密制御できず、高透過性 が発現しなかった [22]。

近年, 圧力, 温度, 電場などの外部刺激に構造応答性を示すフレキシブル有機金属フレ ームワーク (FL-MOF) が注目されている [23-25]。このような「構造応答性」は分離プロ セスで利用可能で, 2,2'-bis(4-carboxyphenyl)hexafluoro propane と zinc nitrate hexahydrate の自己集合から得られるフッ素系 MOF は、ペルフルオロ化合物が CO₂ と静 電相互作用を示すため、N₂ に対して高い CO₂ の選択性を示した [24]。北川らは、このよ うな材料設計にはファンデルワールス力, π-πスタッキング, 水素結合などの「相互作用」 を導入することが重要としている。

SiO₂-ZrO₂複合セラミック膜は、分子レベルでSiO₂とZrO₂を複合化した複合酸化物で 気体分離膜への応用が期待されている[26]。我々の研究グループでは、SiO₂-ZrO₂複合セ ラミック膜において、ネットワーク構造をキレート配位子で修飾した状態では、高分子的 な透過メカニズムを示すことを明らかにし、キレート配位子を*in-situ*で炭化できる可能 性を報告している[27]。熱分解によって生成したフリーカーボンにより、CO₂分子と相互 作用を示すことが期待でき、本研究では図1に示すSiO₂-ZrO₂-acetylacetonateを熱分解 して炭化したSiO₂-ZrO₂(以下、C-SiO₂-ZrO₂)のCO₂吸着特性、マイクロポーラス構造 を評価した。C-SiO₂-ZrO₂ とCO₂の相互作用は、収着実験によって様々な温度で評価し、 50℃および300℃における純ガス透過実験によりCO₂の透過特性を明らかにした。



図1 SiO₂-ZrO₂-acからC-SiO₂-ZrO₂への熱分解とネットワーク形成概略図

2. 実験方法

2.1 SiO₂-ZrO₂-ac 粉末の調製と C-SiO₂-ZrO₂膜の製膜

SiO₂-ZrO₂-ac ゾルの調製は、5 wt%の SiO₂-ZrO₂-ac ポリマーゾル(以下 SZa4 ゾル)を 2 段 階で調製した。第 1 段階では、ジルコニウム(iv) tert-ブトキシド溶液(ZrTB, 1-ブタノール溶媒 80%, Aldrich)をエタノール(5 wt%)中でアセチルアセトン(Hacac, 純度 99%, Aldrich)と室 温で 1 時間反応させた(ZrTB/Hacac=1/4)。第 2 段階では、純度 98%のテトラエトキシシラン (TEOS, Aldrich)の 5wt%溶液(溶媒:エタノール)を、イオン交換水と塩酸(37%, ナカライテス ク)を触媒として、以下の割合でアセチルアセトンで修飾したジルコニウム(iv) tert-ブトキシドと 共加水分解・縮重合させた(TEOS/ZrTB/H₂O/HCl=1/1/4/0.25)。加水分解、縮重合反応は室 温で 12 時間以上攪拌し行った。SZa4(SiO₂-ZrO₂-acectylacetonate)粉末は、SZa4 ヅルを 40 ~50℃で乾燥させることで調製した。Carbon-SiO₂-ZrO₂ 粉末は、SZa4 粉末を所定の条件 (550, 750℃, N2 雰囲気)で 25 分間焼成して調製した。

Carbon-SiO₂-ZrO₂膜は、多孔質 α -アルミナ管(porosity, 50%; average pore size, 1 µm; outside diameter, 10 mm; tube length, 100 mm, Nikkato, Co., Japan)を用いて製膜した。2 種類の α -アルミナ粒子(大粒子:2 µm, 小粒子:0.2 µm)を、SiO₂-ZrO₂(Si/Zr=1/1)コロイドゾルをバインダーとしてコーティングし、750°C、空気雰囲気で 10 分焼成することで、 α -アルミナ粒子層を作製した。次に、SiO₂-ZrO₂(Si/Zr=1/1)コロイドゾルをコーティングし、粒子層と同様に焼成することで中間層を形成した。分離活性層は、1wt%SZa4 ゾルを中間層上にコーティングし、600ml min⁻¹の N₂ガスフロー下のもと550°Cで 20 分間焼成することで製膜した。

2.2 気体透過実験

図 2 に気体透過測定装置の概略図を示す。作製した CSZ550 膜を 200°C, 100ml min⁻¹の He フロー下で約 12 時間保持して吸着水を除去した。CSZ550 膜の純ガス透過試験は, 高純度 ガス(H₂, He, CO₂, N₂, CH₄, CF₄, SF₆の順で)を用いて実施した。各ガスは, 50~300°Cの温 度範囲で, 絶対圧 200~500 kPa で膜モジュールの上流側に供給した。透過側の圧力は大気 圧に保ち, 透過ガス流量は石鹸膜流量計(HORIBA-STEC, Japan)を用いて測定した。



図2 気体透過測定装置の概略図

3. 結果と考察

3.1 SiO₂-ZrO₂-acのC-SiO₂-ZrO₂への炭化と炭素状態の同定

図3にSiO₂·ZrO₂·ac, C·SiO₂·ZrO₂(550および750℃で熱分解)のCP-MAS-¹³C-NMRスペクトルを示す。SiO₂·ZrO₂·acは、¹³C-¹H双極子カップリングから生じるacac・キレートのエノール型とケト型の異なる官能基のピークが検出された。アセチルアセトンのケト異性体はカルボニル基(C=O)が2つ存在するため、遷移金属とキレート結合することができないが、エノール型のアセチルアセトンは、1つのカルボニル基(C=O)と1つのエノール基(C=C·OH)を有し、アセチルアセトネートを形成しやすいため、キレート形成が容易になる。SiO₂·ZrO₂·acスペクトルのピークを拡大すると非常に小さな強度を示し、純粋なアセチルアセトンのスペクトルと比較して、acac-のエノール型がSiO₂·ZrO₂ に十分に配位されていることが明らかになった[28]。さらに、550、750℃で熱分解したC·SiO₂·ZrO₂のスペクトルは、~130 ppmに幅広いピークを示し、2つのスピニングサイドバンドを示した。スピニングサイドバンドは、芳香族やカルボニルCなどのsp2混成グラファイトカーボンへと変化していることを示すもので、¹³C-¹HをデカップリングしたDD-MAS-¹³C-NMR (dipolar decoupling mode)では、非常にシャープなピークが確認された。550℃と750℃で熱分解したC·SiO₂·ZrO₂試料は同様のスペクトルを示し、化学的・物理的状態がほとんど変化しなかった。





図 4a~dは、カーボンナノ粒子の存在を検出するために用いた 5 nm スケールの SiO₂-ZrO₂ac(図 4a および 4b)と C-SiO₂-ZrO₂(図 4c および 4d)の TEM 顕微鏡写真における電子回折 パターンを比較したものである。図 4b と図 4d は、図 4a と図 4c を高コントラストに変換したもの で、粒子のエッジが確認できる。TEM 写真より、C-SiO₂-ZrO₂ネットワーク内に高分散した 1 nm 以下のフリーカーボンが確認された。



図 4 SiO₂-ZrO₂-ac の TEM 写真: (a) original; (b) high-contrast と C-SiO₂-ZrO₂-550: (c) original; (d) high-contrast(挿入図 電子線回折像)

3.2 C-SiO₂-ZrO₂膜における CO₂の特異な透過特性

図 5 (a) に 25℃と 35℃における SiO₂·ZrO₂·ac 粉末と C·SiO₂·ZrO₂ 粉末の吸着等温線を 示す。どちらの試料も測定した圧力範囲において, Langmuir の I 型吸着等温線を示した。 25℃と 35℃における SiO₂·ZrO₂·ac の吸脱着等温線は可逆的で, SiO₂·ZrO₂·ac の構造や表 面に対する CO₂吸着の影響はほとんどないことが示された。一方, SiO₂·ZrO₂·ac を炭化し た C·SiO₂·ZrO₂は, CO₂の吸脱着等温線は吸着量が少ないにもかかわらず, 大きなヒステ リシスを示した。CO₂の臨界温度 (31℃)を超える温度でヒステリシスが存在することか ら,毛管凝縮でなく, CO₂吸着に伴う C·SiO₂·ZrO₂構造変化の可能性が示唆された。Culp らは,ホスト・ゲスト相互作用がホスト格子の形状変換をエネルギー的に補償できる場合, ホスト構造がゲスト分子の形状に適合する可能性があることを報告している [30]。 図 5 (b) に 25, 30, 35℃で Clausius-Clapeyron 式を用いて算出した SiO₂-ZrO₂-ac と C-SiO₂-ZrO₂ への CO₂ 吸着熱を示す。C-SiO₂-ZrO₂ の CO₂ 吸着熱は, SiO₂-ZrO₂-ac の~34 kJ mol⁻¹に比べ,極めて大きい値を示した (~170 kJ mol⁻¹)。Lin らは CO₂ の化学吸着に 必要な理論ポテンシャルエネルギー面 (PES) バリアを~350 kJ mol⁻¹と報告しており [31], C-SiO₂-ZrO₂への CO₂ 吸着熱は格子構造を変形させて吸着を可能にするのに十分なエネル ギーであると考えられる。



図 5 (a) 25℃と 35℃で測定した SiO₂-ZrO₂-ac 粉末と C-SiO₂-ZrO₂粉末への CO₂吸脱着 等温線 (b) 25, 30, 35℃での SiO₂-ZrO₂-ac と C-SiO₂-ZrO₂粉末の CO₂吸着熱

図 6 (a), (b)に C-SiO₂-ZrO₂-550 膜を用いて 50℃と 300℃で He, H₂, CO₂の純ガス透過 率の絶時変化を上流圧力 200 kPa で測定した結果を示す。いずれの測定温度においても CO₂については, 経時的に透過率が減少し, 定常状態に達する傾向が確認された。これは, 細孔内に吸着した CO₂による自己透過阻害が発現し, CO₂の透過が阻害されていることを 示唆している。50℃において CO₂ 透過率が定常値に達した後で, He と H₂ 透過率の経時 変化を測定した結果, He と H₂ はそれぞれ初期値の約 65%と 79%までしか回復しなかっ た。これは, 吸着した CO₂が He と H₂の透過を阻害する効果が発現したためと考えられ る。300℃においても He と H₂の透過率がそれぞれ 80%と 83%までしか回復しなかった ことから, 従来のシリカ系多孔膜とは異なり 300℃においても強い CO₂吸着により透過ブ ロッキングが発現することが明らかになった。



図 6 C-SiO₂-ZrO₂-550 膜における 50℃(a) と 300℃(b) での 純ガス(He, H₂, CO₂) 透過率の経時変化

4. 結論

本研究ではSiO₂-ZrO₂- acetylacetonate を熱分解して炭化した C-SiO₂-ZrO₂の CO₂吸着 特性,マイクロポーラス構造を評価した。C-SiO₂-ZrO₂ と CO₂の相互作用は,収着実験に よって様々な温度で評価し、50℃および 300℃における純ガス透過実験により CO₂の透過 特性を明らかにした。TEM 分析より 550℃で炭化処理することで,C-SiO₂-ZrO₂ネットワー ク内に 1 nm 以下でフリーカーボンを高分散させることが可能であった。C-SiO₂-ZrO₂は, CO₂ の吸脱着等温線は吸着量が少ないにもかかわらず,大きなヒステリシスを示し,CO₂吸着 に伴う C-SiO₂-ZrO₂の構造変化の可能性が示された。C-SiO₂-ZrO₂-550 膜は,細孔内に吸 着した CO₂による自己透過阻害が発現し、300℃においても He と H₂の透過率がそれぞれ 80%と 83%までしか回復しなかったことから,従来のシリカ系多孔膜とは異なり強い CO₂ 吸着により透過ブロッキングが発現することが明らかになった。

謝辞

本研究は2021年度の公益財団法人 JFE21 世紀財団の技術研究助成により行われました。ここに感謝の意を表します。

参考文献

- 1. K. Xie, Q. Fu, G.G. Qiao, P.A. Webley, J. Membr. Sci., 572 (2019) 38.
- 2. T.C. Merkel, H. Lin, X. Wei, R. Baker, J. Membr. Sci., 359 (2010) 126.
- 3. M. Pera-Titus, Chem. Rev., 114 (2014) 1413.
- Q. Chen, M. Luo, P. Hammershøj, D. Zhou, Y. Han, B.W. Laursen, C.-G. Yan, B.-H. Han, J. Am. Chem. Soc., 134 (2012) 6084.
- 5. S. Bandehali, A. Moghadassi, F. Parvizian, S.M. Hosseini, T. Matsuura, E. Joudaki,

J. Energy Chem., 46 (2020) 30.

- M. Vinoba, M. Bhagiyalakshmi, Y. Alqaheem, A.A. Alomair, A. Pérez, M.S. Rana, Sep. Purif. Technol., 188 (2017) 431.
- 7. S. Kim, S.H. Han, Y.M. Lee, J. Membr. Sci., 403 (2012) 169.
- L. Yu, M. Kanezashi, H. Nagasawa, M. Guo, N. Moriyama, K. Ito, T. Tsuru, ACS Appl. Mater. Interfaces, 11 (2019) 7164.
- M. Guo, M. Kanezashi, H. Nagasawa, L. Yu, J. Ohshita, T. Tsuru, J. Membr. Sci., 611 (2020) 118328.
- 10. Y. Han, D. Wu, W.S.W. Ho, J. Membr. Sci., 567 (2018) 261.
- 11. Y. Han, W.S.W. Ho, , J. Polym. Sci., 58 (2020) 2435.
- 12. S. Rafiq, L. Deng, M.B. Hägg, ChemBioEng Reviews, 3 (2016) 68.
- Y. Ji, M. Zhang, K. Guan, J. Zhao, G. Liu, W. Jin, Adv. Funct. Mater., 29 (2019) 1900735.
- S. Wang, Y. Xie, G. He, Q. Xin, J. Zhang, L. Yang, Y. Li, H. Wu, Y. Zhang, M.D. Guiver, Angew. Chem. Int. Ed., 56 (2017) 14246.
- 15. X. Ren, T. Tsuru, Membranes, 9 (2019) 107.
- 16. T. Tsuru, J. Chem. Eng. Jpn., 51 (2018) 713.
- 17. M. Guo, M. Kanezashi, Membranes, 11 (2021) 310.
- 18. M. Kanezashi, K. Yada, T. Yoshioka, T. Tsuru, J. Am. Chem. Soc., 131 (2008) 414.
- I. Agirre, P.L. Arias, H.L. Castricum, M. Creatore, E. Johan, G.G. Paradis, P.H. Ngamou, H.M. van Veen, J.F. Vente, Sep. Purif. Technol., 121 (2014) 2.
- 20. X. Yu, H. Nagasawa, M. Kanezashi, T. Tsuru, J Mater. Chem. A, 6 (2018) 23378.
- 21. H.R. Lee, M. Kanezashi, Y. Shimomura, T. Yoshioka, T. Tsuru, AlChE J., 57 (2011) 2755.
- 22. M. Kanezashi, Y. Yoneda, H. Nagasawa, T. Tsuru, K. Yamamoto, J. Ohshita, AlChE J., 63 (2017) 4491.
- 23. Kitagawa, K. Uemura, Chem. Soc. Rev., 35 (2005) 109.
- C. A. Fernandez, P. K. Thallapally, R. K. Motkuri, S. K. Nune, J. C. Sumrak, J. Tian, J. Liu, Crys. Growth Des., 10 (2010) 1037.
- G. A. Craig, P. Larpent, S. Kusaka, R. Matsuda, S. Kitagawa, S. Furukawa, Chem. Sci., 9 (2018) 6463.
- K. Yoshida, Y. Hirano, H. Fujii, T. Tsuru, M. Asaeda, J. Chem. Eng. Jpn., 34 (2001) 523.
- S. Lawal, M. Kanezashi, H. Nagasawa and T. Tsuru, J. Membr. Sci., 599 (2020) 117844.
- 28. X. Tao, W. Qiu, H. Li, T. Zhao, Polym. Adv. Technol., 21 (2010) 300.

- 29. J. C. C. Freitas, F. G. Emmerich, G. R. C. Cernicchiaro, L. C. Sampaio, T. J. Bonagamba, Solid State Nucl. Mag., 20 (2001) 61.
- 30. J. T. Culp, M. R. Smith, E. Bittner, B. Bockrath, J. Am. Chem. Soc., 130 (2008) 12427.
- 31. S. C. Xu, S. Irle, D. G. Musaev, M. C. Lin, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 21135.